(54) LIGHT SOURCE DEVICE FOR IRRADIATING CELL IN AUTOMATIC ANALYSIS INSTRUMENT FOR CELL

(11) 60-260830 (A)

(43) 24.12.1985 (19) JP

(21) Appl. No. 59-117551

(22) 7.6.1984

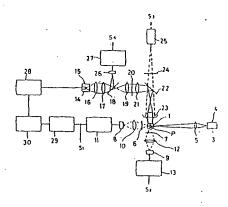
(71) FUJISAWA YAKUHIN "OGYO K.K. (72) KIYOSHI HATSUTORI(2)

(51) Int. Cl. G01N21/64

PURPOSE: To enable high-brightness excitation and to obtain high fluorescent sensitivity by lighting a flash lamp of a light source for excitation of fluores-

cence when the arrival of a cell at a measuring position is detected.

CONSTITUTION: The beam from a semiconductor laser 3 irradiates continuously the measuring position P and the cells in the coaxial laminar flow in a flow cell I flows by each piece downward by passing through the position P. A forward scattering signal S_1 and a 90° scattering signal S_2 increase instantaneously when the cell passes through the position P. The information on the size of the cell is obtd. by the signal S₁ and the information on the internal structure of the cell is obtd. by the signal S2. A cell detecting circuit 29 monitors at all times the signal S_t and outputs the cell detection signal when the S_t exceeds a trigger level. A xenon flash lamp 14 is instantaneously lighted by the signal. The fluorescence emitted from the cell enters a photomultiplier 25 by passing through a fluorescence selecting filter 24 and generates a fluorescence signal S₃.



11.13.27: amplifier circuit, 28: power source for lamp. 3 trigger circuit, So compensation signal



⑩ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-260830

@Int_Cl_1

識別記号

庁内整理番号

⑩公開 昭和60年(1985)12月24日

G 01 N 21/64

7458-2G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

細胞自動分析装置における細胞照射光源装置 砂発明の名称

> ②特 願 昭59-117551

❷出 願 昭59(1984)6月7日

部 砂発 明 者 服

潰

宝塚市逆瀬台3-3-17 大阪市城東区東中浜9-7-6

砂発 明 者

西 山

太一郎

砂発 明 者 酒 井 藤沢薬品工業株式会社 ⑪出 顋 人

文 彦

吹田市桃山台5-1-C20-813 大阪市東区道修町4丁目3番地

①代 理

弁理士 岸本 瑛之助

外4名

1、発明の名称

構題自動分析装服における相覧照射光源装置

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 一定の測定位置を通過する同軸層筬中の 賴腔に光を照射しこのときに発生する發光によ り制的を分析する機能を少なくとも有する和的 自動分析装置において、フラッシュランプを使 用した鉄光励起用光級と、細胞が測定位製に建 したことを検出する糖脂検出回路と、糖胞検出 回路が桐皰を検出したときに質光励起用光顔の フラッシュランブを点灯させるためのトリガ信 月を発生するトリガ発生回路とを備えている制

(2) 相数検出回路が、半導体レーザを使用し、 た散乱光用米那加云の中の田井。

によって相胞が測定位置に渡したことを検出す るものである特許請求の範囲第 1 項に記載の概 股照射光源装置。

3. 発明の詳報な説明

産業上の利用分野

この発明は、網胞自動分析装置における機能 **肌射光凝装置、さらに詳しくは、医学や生物学** などの分野で、病気の診断、治療、研究、細胞 の検査、分類などを目的として、少なくとも質 光特性に異いて細胞を分析する機能を有する装 選において、粗脆に要光励起用の光を照射する ための装置に関する。

従来技術

上記のような機胞自動分析装置として、フロ ーセル内の一定の測定位数を通過する同性限決

特別昭60-260830(2)

発明の構成

この発明による細胞風射光線装置は、一定の測定位置を通過する同軸層流中の細胞に光を風別しこのときに発生する預光により細胞を分析する機能を少なくとも有する細胞自動分析装置において、フラッシュランプを使用した 夜光励起用光線と、細胞が測定位置に違したことを検出する細胞検出回路と、細胞検出回路が細胞を検出したときに顕光励起用光線のフラッシュランプを点灯させるためのトリルは写を発生するトリガ発生回路とを備えているものである。

実 庶 例

第 1 図は規約自動分析装置の光学系および電 景系の構成を観略的に示しており、光学系はこれを上から見た状態で示してある。なお、以下の説明において、第 1 図の紙面表明を上、同果

光を照射し、このときに制照によって発生する 前方散乱光、90度方向散乱光および観光に基 いて、細胞の大きさ、内部構造および観光特性 を調べるものが知られている。アルゴンレーザ は高輝度光源として好適であるが、大形でかつ 両値であるという問題がある。また、アルゴン レーザのかわりに属圧水銀灯を用いたものも知 られている。高圧水銀灯は、レーザに比べ、の であるが、海命が短く、しかも輝度が低いの で、観光感度を上げるために開口角の大きな油 漫系レンズを使用する必要があり、このために 競光集光系の光学系を複雑かつ大形にしている。

発明の目的

この発明の目的は、細胞自動分析装置において、小形で強光感度が高く、しかも安価で寿命の長い細胞照射光額装置を提供することにある。

側を下とし、同図の左側を前、右側を後、下側を左、上側を右とする。

相談自動分析装置は、中心部に相談を閉込めた液体を同輪層次の形で上から下に流すための更直管状のフローセル(1)を備えており、同橋層流中の相談はフローセル(1)の中心部の一定の測定位置(P)を通って流れる。測定位置(P)の设方には半導体レーザ(3)を使用した放乱光用光線(4)が配置されており、これから出た半導体レーザ光(波長780または830mm 連続光)はレンズ(5)により測定位置(P)に直径約50μm 程度に集光する。測定位置(P)に直径約50μm 程度に集光する。測定位置(P)の前方および左側方にそれぞれの出た板(6)のさらに向方および左側方の遮光板(7)のさらに左側方にそれぞれフォトセル(8)

(9) が配置されている。そして、半導体レーザ光の制態による前方散乱光はレンズ(10)により前方のフォトセル(8)に集光し、フォトセル(8)の出力は増配回路(11)を軽で前方散乱信号(S.)として取出される。また、半導体レーザ光の90度方向散乱光はレンズ(12)により左側方のフォトセル(9)に集光し、フォトセル(9)の出力は増幅回路(13)を軽で90度方向散乱信号(S₂)として取出される。測定位置(P)の右斜め前方にキセノンフラッシュランブ(14)を使用した強光励起用光難(15)が後向きに配置されており、これから出る光は、レンズ(16)(17)、光軸に対し45位所けて配置されたガラス坂(18)、レンズ(19)、励起用フィルタ(20)およびレンズ

(21)を通り、湖定位置(P)の右側方に配置

特開昭60-260830(3)

されたダイクロイックミラー(二色性ミラー) (22)で反射したのち、螢光集光レンズ (23) を通って測定位器(P)の相関に照射される。 そして、細胞に光を限別したときに発生する質 光は螢光集光レンズ(23)、ダイクロイックミ ラー (22) および 螢光選択フィルタ (24) を通 **ってフォトマル(光電子増倍管) (25) に集光** し、フォトマル(25)の出力が螢光信号(Sょ) として取出される。また、フラッシュランプ (14)から出てレンズ(16)(17)を通った光 の一郎はガラス版 (18) で反射してフォトセル (26) に集光し、フォトセル (26) の出力は増 櫛回路(27)を軽て補償用信号(S4)として 取出される。一方、前方散乱光用增幅回路 (11) とフラッシュランプ (14) のランプ電源 (28) との間に、賴腹検出回路(29)およびトリガ発

生回路 (30) が扱けられている。キセノンフラッシュランプ (14) の特性の 1 例を挙げれば、消費能力 1 5 W (ピーク出力 3 0 0 0 W)、連様スペクトル3 0 0 ~ 8 0 0 nm、最大線返し周波数 2 . 5 k Hz 、 方命 1 0 ® 回である。

上記の聴取において相胞の分析を行なう場合、 半導体レーザ光が連続的に測定位置(P)を照 別しており、フローセル(1)内の同性層深中 の細胞は1個ずつ測定位置(P)を適って下方 に流れる。フローセル(1)内の液体の流波は 約10m/sec 以下、フローセル(1)内を流 れる細胞数は約10,00個/sec である。細胞 が測定位置(P)を通過するときに、この細胞 に半導体レーザ光が照射されて放乱光が生じ、 これにより、前方放乱信号(S」)および90 底方向散乱信号(S2)が瞬間的に増大する

(卵2図参照)。そして、前方散乱信号(Si) の大きさによって細胞の大きさに関する情報が 得られ、90度方向散乱信身(Sz)の大きさ によって期間の内部構造に関する情報が得られ る。一方、根態検出回路(29)は前方散乱信号 (S1)を常時監視しており、棚間が測定位置 (P) に達して前方散乱信号 (S,) が一定の トリガレベル(し)を越えたときにトリガ発生 回路 (30) に細胞検出信号を出力する。第2回 に示すように、トリガ発生回路 (30) は網胞検 出信号を受けてランプ電源(28)にトリカ信号 を出力し、これにより、キセノンフラッシュラ ンプ (14) が瞬間的に点灯する。この光は蛍光 色素に最適な励起用フィルタ(20)を通ったの ち、謝定位置(P)の細胞に限別する。このと き、細胞から散乱される光は色素による質光、

In Post of the

励起光および半導体レーザ光による散乱光であ り、これが螢光のみを選択する螢光選択フィル タ (24) を通ったのちフォトマル (25) に入射 し、螢光信号(Sょ)の大きさによって細胞の **質光特性に関する情報が得られる。ランプ電源** (28) にトリガ信号が入力してからフラッシュ ランプ(14)が発光を開始するまでの遅延時間 はり、2μ5程度であり、その他の電子回路の 遅れ時間を含めても、前方散乱信号がトリカレ ベル(L)を越えでからフラッシュランプ(14) が点灯開始するまでの時間(しょ)は0.5 μs 以下である。また、フラッシュランプ (14) の発光時間(しょ)は1~15μs である。そ して、機能が測定位置(P)を通過する時間は 前方故私信鳥(Sょ)がトリガレベル(L)を **返えている時間(し。)と★は※1~**

時開昭60-260830(4)

間(しょ)は、概覧の大きさにもよるが、前記 の条件下では5μs 以上である。したがって、 相胞が測定位置(P)を過過している間にフラ ッシュランプ(14)を点灯させて細胞の螢光特 性を調べることができる。また、半導体レーザ 光の故長が780または830mmあるのに対 して、通常使用される賢光色素(FICT, P E、PI)の受光波長は650mm以下であり、 半導体レーザ光と螢光の波長は十分離れている ので、半導体レーザ光の影響はフィルタ(24) で簡単に除去できる。仮に半導体レーザ光の影 響が無視できない螢光色素があったとしても、 この場合には、半導体レーザ光の前方散乱信号 (S₁)のピーク値を検出したのちにレーザ発 <u> 版を停止してフラッシュランプ(14)を点灯す</u> るようにすれば、前方放乱信号(Sょ)がトリ

ガレベル(L)を超えてからピーク値に選するまでの時間が3μs以下で、レーザ発掘の立上り、立下り時間が約0.5 nsであるから、時間遅れ3μs 程度で半導体レーザ光の影響を受けない 取光信号を検出することができる。また、キセノンフラッシュランプ(14)の光強度の変動(通常10%以下)は 欧光信号(S。)の大きさに影響するが、 螢光信号(S。)と 補 慣用信号(S。)のピーク値の比をとることにより、変動分を補償して正確な測定値を得ることができる。

また、上記実施例の場合、相脱の大きさなどを知るための放乱光用鉛 級(4)に半導体レーザ 代の相胞により (3)を使用し、半導体レーザ 光の相胞による前方放乱信息(S」)によって 相助が 測定 位置 (P)に達したことを検出しているので、 散

弘光用光級(4)および母光的 尼用光線(15)ならびにこれらの電報を含めても、アルゴンレーザや高圧水銀灯を使用する 従来の光線に比べて、小形で安価であり、しかも寿命が長い。なが、前方放乱信号(S・)のかわりに90度 方向放乱信号(S・)のかわりに90度 方の放乱信号(S・)によって棚節を検出に必ずしるとなが、相関の大きさを開しなくてもよい。たとえするよりによって棚節が選定しているときを検出することができる。

発明の効果

時間昭60-260830(5)

この発明による制度別光級質数は、フラッシュランプを使用した質光的起用光級と、網度が測定位置に達したことを検出する細胞検出回路が細胞を検出したときに登光励起用光線のフラッシュランプを点灯させるとののトリガ信号を発生するトリガ発生回路を破めているので、細胞が測定位置を通過するとのみフラッシュランアを点灯させるととまり、高輝度別にが可能となり、高輝度別にが可能となり、高輝度別にが明られる。また、従来のようなアルゴンではが明られる。また、従来のようなアルゴンで、米線の小形化、低価格化および長寿命化を図ることができる。

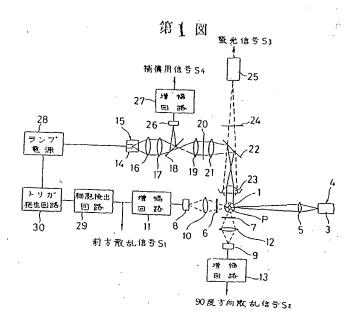
4. 図面の簡単な説明

図面はこの発明の実施例を示し、第1図は欄/ 脱自動分析技器の光学系および薄気系の駅略機 成図、知2図はフラッシュランプが点灯すると きの前方液乱傷号、トリガ発生回路の出力およ びフラッシュランプの光出力を示すタイムチャ ートである。

(14) … キセノンフラッシュランプ、 (15) … 領光別尼用光源、 (29) … 棚舶検出回路、 (30) … トリガ発生回路。

以上

特許出願人 歷沢兼品工業株式会社 代 理 人 序 本 项 之 助 分 分 名



				بي ٠	A. Carrier
				·	
				*	
				·,	<i>,</i>
•	٠				
			-,		
			÷		
			,		
	•				